(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-97583

(43)公開日 平成5年(1993)4月20日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 3 0 B	29/04	R	7821-4G		
C 0 1 B	31/06		7003-4G		
C 2 3 C	16/26		7325-4K		
C 3 0 B	29/04	E	7821-4G		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 5 頁)

(21)出願番号	特顧平3-290724	(71)出願人	000153878 株式会社半導体エネルギー研究所
(22)出願日	平成3年(1991)10月8日	(72)発明者	神奈川県厚木市長谷398番地 角野 真也 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半 導体エネルギー研究所内

(54)【発明の名称】 ダイヤモンド膜作製方法

(57)【要約】

【目的】 本発明はダイヤモンド膜作製において、反応 ガスの安全性および経済性を追求することを目的とする ものである。

【構成】 通常は液体で存在しているOH基を含むアル コール類のみを用い、すなわち水素などで希釈せずに、 ダイヤモンド膜を作製する方法を採用したものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ダイヤモンド膜を作製する方法において、 反応ガスとしてOH基を含むアルコール類を用いる際 に、水素を用いて希釈せずに、OH基を含むアルコール 類のみを用いて合成されることを特徴とするダイヤモン

【請求項2】請求項1において、有磁場マイクロ波プラ ズマCVD装置を用いて成膜することを特徴とするダイ ヤモンド膜作製方法。

【請求項3】請求項1において、ダイヤモンド膜が合成 10 される基体または基板が200℃以下であることを特徴 とするダイヤモンド膜作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はダイヤモンド膜を、危険 の少ない反応ガスを用いることによって作製する方法に 関する。

【0002】本発明はダイヤモンド膜の低温合成に関す る、

[0003]

【従来の技術】従来、ダイヤモンド膜を作製する際に、 反応ガスとしては、炭素原子を含む原料ガスと該原料ガ スを希釈する希釈ガスを混合したものが用いられてい る。また、前記混合ガスに酸素、ヘリウムなどの添加ガ スを微量加えて用いることもある。

【0004】例えば、マイクロ波プラズマCVD(化学 的気相成長法)装置を用いる場合においては、炭素原子 を含む原料ガスとしてメタンを用いる際、水素で希釈す ることがダイヤモンド膜を作製する必要条件である。マ イクロ波プラズマCVD装置は図1に示してあるよう に、反応ガスをマイクロ波(周波数が2.45GHz) によって励起することにより基板4上にダイヤモンド膜 を合成する方法であり、ダイヤモンド膜が合成される際 のメタン濃度は、 $0.5\sim1.5\%$ である。ダイヤモン ド膜の成膜速度はメタン濃度に対応して増加するが、質 は逆に低下する。

【0005】マイクロ波プラズマCVD法によるダイヤ モンド成膜では核発生とその後の成膜においてメタン濃 度を変える方法が用いられることもあるが、該方法であ ってもメタン濃度は最大10%程度である。また、マイ 40 クロ波プラズマCVD法においては、ダイヤモンド膜合 成における基体または基板の温度は700~900℃が 適しており、該温度以下では析出物がないことさえあ り、また該温度以上では非ダイヤモンド成分が増大し、 黒鉛状になる。

【0006】他にダイヤモンド膜を形成する方法として は熱フィラメントCVD法がよく利用されている。該方 法とは、例えば図2に示すように石英反応管1に反応性 ガスをガス導入口2より流入し金属タングステン(また はタンタル)製フィラメント3に電流を流し該フィラメ 50 イクロ波プラズマCVD装置の概略図を図3に示す。磁

ントを1500~3000℃に加熱し熱電子を放出させ ることによって基板4を700~1300℃に加熱す る。化学反応により基体または基板4上にダイヤモンド 膜を合成する方法である。この時、反応容器内の圧力は 1~350Torrに維持されている。それゆえ、熱C VD法は安価で手軽に行うことができる方法である。本 熱フィラメントCVD法においては、水素に対する原料 ガス濃度は、通常0.5~2%である。また、酸素を添 加ガスとして用いることにより成膜速度は向上すること がわかっているが、水素に対する酸素濃度は0.5%程 度が最適であり、それ以上になるとダイヤモンド膜が存 在しなくなってくる。

【0007】以上のように、ダイヤモンド膜を合成する 際、反応ガスとしてメタンなどの炭化水素ガスを用いる と、水素で数%に希釈することが絶対に必要である。さ らに、ダイヤモンド膜が合成される基体または基板は、 700℃以上に加熱されなければならない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】従来の技術では、炭素 を含む原料ガス例えばメタン等は、爆発性の非常に高い 水素により希釈することが絶対に必要であり、危険性が 常に付きまとう。さらに、炭素を含む原料ガスとして炭 化水素を用いるために、可燃性が常に存在している。 【0009】また、ダイヤモンド膜が合成される基体ま たは基板の温度は700℃以上と高く、耐熱性の低い低 融点の物質上にダイヤモンド膜を合成することは非常に 困難であり、さらに、高温における成膜では基体または 基板を取り出した際の冷却により、ダイヤモンド膜にひ びが生じ剥離の原因になる可能性がある。

30 [0010]

【問題を解決するための手段】そこで我々は十分な安全 性を考慮するために鋭利研究を重ねてきた結果、可燃性 の強い炭化水素を用いる必要なしにダイヤモンド膜を合 成することが可能である方法を発明した。すなわち、反 応ガスとしてOH基を含むアルコール類を用いることに よっても、ダイヤモンド膜が合成されることがわかっ た。さらに、鋭利研究を重ねた結果、アルコール類を反 応ガスとして用いるのであれば、水素で希釈せずとも膜 質の良いダイヤモンド膜を作成することができることが わかった。このようにアルコール類100%でダイヤモ ンド膜が成膜できるので、原料ガスが非常に安価にたや すく手に入る方法によってダイヤモンド膜を合成するこ とが可能になった。

【0011】上記のOH基を含むアルコールのみを用い てダイヤモンド膜を合成する方法においては、有磁場マ イクロ波プラズマCVD装置を用いた場合に、最も効果 が顕著に現れる。すなわち、有磁場マイクロ波CVD法 は1Torr以下の減圧で行う方法であり、液体原料が 気化されやすい条件になっているからである。有磁場マ

場コイル7による磁界とマイクロ波導波管6から反応室 に導入されたマイクロ波の相互作用を利用してガス導入 口2より流入される反応性ガスを効率よく励起し、基板 4上にダイヤモンドを含む炭素膜またはダイヤモンド膜 を形成する。基板4は基板保持板を加熱することにより 外部コントロールされている。また、浮遊電界8を基板 4に加えることもできる。反応ガスとしてはメタン、一 酸化炭素、エチレン、メタノール、エタノールなどの通 常において気体または液体の炭化水素を水素で希釈した ガスが用いられている。また、水、二酸化炭素、酸素を 10 少量添加したガスも用いられている。

【0012】本ダイヤモンド成膜においては、液体原料 100%を用いてダイヤモンド合成を行うが、この際、 バブリングをすることなしに加熱などの方法により液体 をガス化しなければならない。また、液体タンク内を減 圧にすることにより発生する蒸気圧を用いて反応室に一 定量ガスを送り出すことも、原料液体の蒸気圧によって は可能である。

[0013]

【実施例】

「実施例1」本実施例においては、図3で示した有磁場 マイクロ波プラズマCVD装置を用いてダイヤモンド膜 の成膜を行った。該方法では1Torr以下で成膜を行うこ とができるので、液体をガス化するには有利な方法であ る。以下に成膜条件を示す。基板はø100mmのSi ウェハーを用いた。原料ガスとしてメタノール100c cmを用いた。反応圧力は2.0×10-1Torr、基 板温度は800℃、処理時間は4hr、マイクロ波 (2. 45GHz)出力3kW、最大磁場強度2kGa

uss。膜厚の測定は、成膜の際にSiウェハー上にマ 30 スキング用のダミーSiウェハーを置き、成膜された部 分とマスクにより成膜されなかった部分の段差により行 った。

【0014】上記条件で成膜した結果、膜厚はおよそ3 μmであった。すなわち、成膜速度はおよそ0.75μ m/hrであった。

【0015】図4にφ100mmSiウェハーの中心部 分に成膜された膜の膜質をラマン分光法で測定した結果 を示す。1550 c m-1付近にアモルファス状炭素膜の ブロードなピークが存在しているが、1333cm-1に 40 ダイヤモンドの鋭いピークを確認することができ、ダイ ヤモンド膜が成膜されたことがわかる。

【0016】「実施例2」本実施例においては、実施例 1と同様の有磁場マイクロ波プラズマCVD装置を用い てダイヤモンド膜成膜を行った。但し、本実験では基板 を冷却することにより、基板温度を100℃とした。そ の他の条件は実施例1と同様であり、原料ガスとしてメ タノール100ccmを用いた。反応圧力は2.0×1 0⁻¹Torr、処理時間は10hr、マイクロ波(2.

とした。

【0017】成膜された膜のラマン分光の結果を図5に 示す。アモルファス状のピークがほとんど見られなくな っており膜質の良いダイヤモンド膜であることがわか

4

【0018】段差測定により膜厚を測定するとおよそ1 μm 、成膜速度はおよそ0.1μm/hrであった。従 来、800℃前後の高温で成膜を行うと、実施例1に示 すように成膜速度が0.5~0.8 µmであるので、基 板温度を低温にすることにより膜質は向上するが、成膜 速度は減少することがわかる。しかし、従来の高温成膜 において見られることのあったダイヤモンド膜の剥離現 象はほとんど見られることは無くなった。

【0019】「実施例3」本実施例においては、磁場を 用いないマイクロ波プラズマCVD装置を用いてダイヤ モンド膜の合成を行った。該マイクロ波プラズマCVD 装置の概略図を図1に示す。磁場を用いていないため非 常に簡易な装置になっており、安価である。しかしなが ら、有磁場マイクロ波プラズマC V D法とは違い、ダイ ヤモンド膜を均一に合成することができる大きさは φ 1 cm程度と非常に小さい。しかし、機械的な工夫、例え ば、基板保持台を移動させながら成膜する等の方法を取 ることにより大面積上にダイヤモンド膜を合成すること は可能になる。また、流量コントローラとして微差圧仕 様のものを用いることにより、反応圧力が10Torr 以上と高くても安定に原料ガスを供給できる。

【0020】以下に本実施例における成膜条件を示す。 反応ガスとしてメタノール100ccm、マイクロ波 (2.45GHz)出力 600W、基板はφ2cmの Siウェハー、基板温度750~850℃、処理時間4 hrとした。

【0021】段差測定により、膜厚を測定すると、およ そ2.5 μ mであり、成膜速度はおよそ0.6 μ m/h rであった。前記した膜厚は最大膜厚部分であり、膜厚 のばらつきは±50%程度であった。

【0022】さらに、最大膜厚部分のラマン分光の結果 を図6に示す。アモルファス状炭素膜のラマンピークが 顕著であり、あまり膜質の良いダイヤモンド膜ではない が1333cm-1付近にピークが見られるためダイヤモ ンド成分が膜中に含まれていることが確認でき、この方 法でもダイヤモンド膜の作製が可能であることを示し た。

[0023]

【発明の効果】本発明を用いることによって、爆発性の 高い水素を用いることなく、さらに可燃性の強い炭化水 素ガスを用いることなく、ダイヤモンド膜を作製するこ とができるようになった。また、反応ガスとして通常で は液体である材料を用いるため高圧ボンベなどを用いる 必要がなく安全である。さらに、排気ガスの処理も従来 $45 \mathrm{GHz}$)出力 $3 \mathrm{kW}$ 、最大磁場強度 $2 \mathrm{kGauss}$ 50 水素で希釈していた時より、簡便な方法で行うことがで きるようになった。その上、低級アルコールは非常に安価なため、ダイヤモンド膜を安価な原料で合成できるようになった。

【0024】基板の温度が低温でもダイヤモンド膜が合成されるようになったため、低融点の金属等耐熱性の低い基体または基板上にダイヤモンド膜を合成することができるようになり、さらに熱膨張率が高いためにダイヤモンド膜が剥離していた基板上にも剥離せずにダイヤモンド膜を合成できるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図1】マイクロ波プラズマCVD装置の概略図を示す。

【図2】熱フィラメントCVD装置の概略図を示す。

【図3】有磁場マイクロ波プラズマCVD装置の概略図を示す。

【図4】有磁場マイクロ波プラズマCVD装置を用い

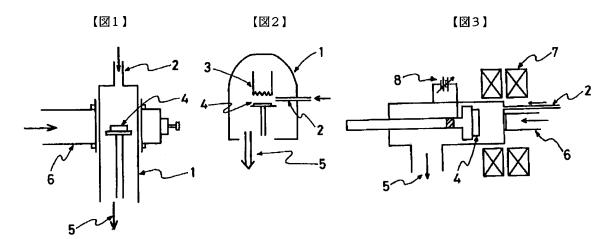
て、基板温度800℃で成膜したダイヤモンド膜のラマンスペクトルを示す。

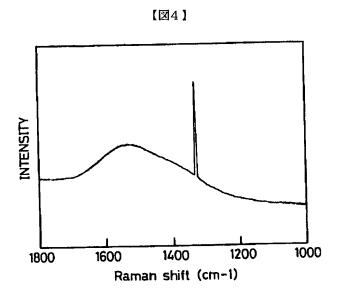
【図5】有磁場マイクロ波プラズマCVD装置を用いて、基板温度100℃で成膜したダイヤモンド膜のラマンスペクトルを示す。

【図6】マイクロ波プラズマCVD装置を用いて成膜したダイヤモンド膜のラマンスペクトルを示す。

【符号の説明】

- 1 石英反応管
- 10 2 ガス導入口
 - 3 フィラメント
 - 4 基板
 - 5 排気
 - 6 マイクロ波導波管
 - 7 磁場コイル
 - 8 浮遊電位





6/25/06, EAST Version: 2.0.3.0

